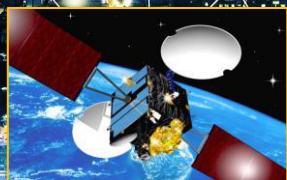


高频&高速接口 噪声测试方案

在线研讨会



近年在WiFi及5G和高速数字的频率不断提高下，待测物的抗噪声逐渐受到重视，不论在高频卫星通讯、国防、各种高速通讯接口中，如何验证待测物的抗噪声能力成为各芯片、网通厂等使用者的难题之一，筑波科技与美商Noisecom推出噪声测试方案，协助客户验证并量化待测物之各项噪声数值，优化产品质量，满足终端客户要求。

本次筑波科技特别邀请Noisecom噪声技术专家在线分享: IC抗噪声测试解决方案。热烈欢迎从事WiFi、5G NR、IC Design、Thunderbolt、Displayport、HDMI、USB3.0、DDR2等高速数字电路开发相关测试应用有兴趣的RD/PL/PE/PM等业界先进报名参加

Time	Topic	Speaker
14:00~14:05	欢迎致词 & 无线通信市场趋势分享 Welcome & Wireless Market Trend	Peter Lee 营销专员
14:05~14:40	噪声应用及整体方案介绍 Noise Application & Solution overview	James Lim Noisecom app Specialist
14:40~14:55	高速数位IC的Vcc电压噪声测试方案 JV9000 / J7000 Series	Leon Chang 专案技术经理
14:55~15:00	Q&A	

活动日期：2021/6/3 (四) 14:00 – 15:00 pm

在线报名：http://register.acesolution.com.tw/2021_Noisecom

中国报名：0755-29351095 蔡小姐

mandy_cai@acesolution.com.cn

台湾报名：03-5500909 ext. 3800 蔡小姐

eva_tsai@acesolution.com.tw



在线报名扫码